

2017年度テストスプリングセミナー

日時：2018年3月5日（月）14時～21時30分

場所：電気ビル共創館カンファレンスB

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館 3F

TEL: 0120-222-084

14:00-14:10 オープニング

温暁青（九州工業大学）

14:10-15:40 講演1

「LSIのテストと評価」

講演概要 LSIの設計・開発・製造の最終工程に位置する「テスト・評価」に関して、その目的と、実際にやることを未経験者にわかるレベルで解説します。最後に、自身の経験から、企業でのLSIのテストと評価に関わる、仕事の内容をいくつか紹介いたします。

講師 麻生正雄（シスウェーブ）

16:10-17:40 講演2

「デバイス試験における課題とわれわれが行うべき開発について」

講演概要 デバイス試験における電源品質制御技術の開発を例に、近年のデバイス試験における課題とは何か？われわれが行うべき開発とは？そのためにはどんなエンジニアが必要か？について私見を述べる。

1. 導入 ～ デバイス試験の課題と行うべき開発とは…
2. 開発の一例 ～ 電源品質制御技術（回路と信号処理の応用）
3. まとめ ～ 期待されるエンジニアとは…

講師 石田雅裕（アドバンテスト）

17:40- 所連絡

18:00-21:30 LSIテストに関する討論会

参加費：無料

参加申込：k_miyase@cse.kyutech.ac.jp（九工大 宮瀬）にメール下さい